Search Notes			

Application/Control No.	Applicant Reexamin
00/000 000	

09/892,622 Examiner

Cong-Lac Huynh

Applicant(s)/Patent under Reexamination MIYAWAKI ET AL. Art Unit

2178

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
715	500	7/23/2006	CLH	
	501.1	7/23/2006	CLH	
	769	7/23/2006	CLH	
	770	7/23/2006	CLH	
		•		

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
	<del> · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>			

	EARCH NOT		)
		DATE	EXMR
East		7/23/2006	CLH
ACM		7/23/2006	CLH
,			
	-		
	:		
			·